

روشی نو در بررسی مکانیسم تخلیه الکتریکی در عایق‌های مایع

نوشته

محمدقلی - محمدی

دانشیار دانشکده فنی

۱ - بکار بردن روش فیزیکی Schlieren در بررسی مکانیسم تخلیه الکتریکی در عایق مایع .

۱-۱ تعریف Schlieren : اگر در جسمی شفاف و همگن نقاطی یافت شوند که در آنها نور عبور

یافته شکست پذیرد و از مسیر خود در فضائی محدود بمیزان بسیار قلیلی منحرف شود این نقاط را Schlieren مینامیم . میزان شکست نور در این نقاط نه تنها از تغییر عدد شکست n در آن نقاط تبعیت میکند بلکه تابعی از فرم و شکل این نقاط نیز هست . چنانکه میدانیم نور در عبور از یک جسم علیرغم ثابت ماندن ضریب شکست نور در تمامی جسم از مسیر خود منحرف میشود اگر که فقط شکل و فرم سطح خارجی جسم از حالت صحیح و لازم خود تغییر یافته باشد .

تعریف Schlieren در فیزیک کلی تر از تعریف محدود بالاست که از گذشته در صنایع کریستال سازی متداول بوده است . تعریف کلی Schlieren در فیزیک عبارت است از :

هر پدیده‌ای که در یک فضای کوچک سبب تغییر محدودی در مسیر نور عبور داده شده از آن فضا

گردد Schliere نامیده میشود .

بنابره تعریف فوق میتوانیم بعنوان مثال موج صوتی با شدت کافی را که قادر باشد انحرافی در مسیر نور تاییده شده پدید آورد بعنوان Schlieren بشناسیم و بالعکس اگر دو سطح یک شیشه مستوی بوده اما موازی نباشد و از این راه انحرافی در مسیر نور پدید آورد هرگز بدان نام Schliere اطلاق نخواهد شد زیرا انحراف نور محدود در فضائی کوچک نمیشود .

مثالهای دیگر برای روشن شدن بیشتر مفهوم Schlieren عبارتند از جابجائی هوای گرم در فضا .

حل نمک در یک مایع و یا مخلوط شدن دو گاز . بکمک وسائل فیزیکی پدیده Schlieren را بهر قسم و از هر نوع باشد می‌توانیم رویت کنیم و شکل و تأثیر این پدیده را نیز Schlieren نام داده‌اند .

۲-۱ روشهای مختلف Schlieren

همانطور که گفته شد از روش Schlieren برای نشان دادن و عکاسی و اندازه گیری و ثبت کمترین مقدار تغییر جهت نور در یک فضای بسیار کوچک استفاده میشود در گذشته با استفاده از این روش میتوانستیم وضعیت داخل یک Schliere را نشان دهیم. امروزه با تکامل این روش نه تنها قادریم که میزان شکست نور و تغییر جهت آنرا اندازه گیری کنیم بلکه از این اندازه گیری برای بیان خصوصیات فیزیکی داخل Schliere (پدیده‌ای که موجب شکست نور در موضعی محدود و بسیار کوچک شده است) نتیجه گیری کنیم. در آزمایشگاهی که اخیراً در آزمایشگاه انجام گرفت از این روش برای رویت تخلیه الکتریکی در عایقهای مایع استفاده شد تا مکانیزم تخلیه الکتریکی بررسی شود. زیرا ایون‌ها و الکترون‌های مؤثر در تخلیه الکتریکی خود باعث شکست نور عبوری از دستگاه آزمایش حاوی عایق مایع خواهند گردید. بنابراین در این گزارش با بیان خلاصه‌ای از اصول این روش فیزیکی تنها به انطباق و استفاده آن در بررسی تخلیه الکتریکی در عایق مایع اشاره میشود.

با آنکه در پاره از موارد با چشم غیر مسلح نیز میتوان مثلاً جابجائی هوای گرم و سرد را روی خط راه آهن در یک روز تابستانی که با کمک شکست نور در حد بسیار قلیلی قابل رویت می‌گردد، دید و یا مکان جابجائی بسیار ریز مجوف در داخل یک شیشه را رویت کرد معذالک برای بررسی‌های فیزیکی در زمینه‌های مختلف بویژه در مسائل تخلیه الکتریکی گازها و مایعات باید آزمایش را بکمک اسبابهای فیزیکی انجام داد.

در کنار چند روش ساده Schlieren روش معروف Toepler دارای مزایا و خصوصیات چندی، چه در زمینه مرئی کردن شکل و چه در بدست دادن حساسیت کافی، میباشد.

۱-۲-۱ روش Toepler

Toepler در آزمایش خود از یک ابژکتیو K برای ایجاد تصویری از مولد نور L استفاده کرده است (شکل ۱). در یک سمت این ابژکتیو همانطور که در شکل دیده میشود مولد نوری N و تیغه محدود کننده سطح نورانی قرار گرفته است و در سمت دیگر ابژکتیو در نقطه a که مرکز C ابژکتیو میباشد تیغه دیگری را قرار میدهم و پس از آن جعبه عکاسی قرار میگردد. ابژکتیو باید صاحب شرایط زیر باشد:

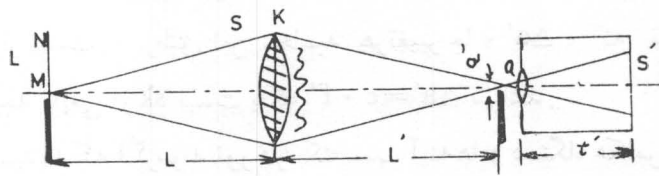
۱-۱-۲-۱-۱ ابژکتیو باید دارای قطر نسبتاً زیادی باشد زیرا که سطح عکس بدست آمده از این قطر تبعیت میکند.

۱-۲-۱-۲ ابژکتیو باید از جنس بسیار خوبی تهیه شده باشد زیرا ابژکتیو نباید بخودی خود عدم دقتی در شکست نور پدید آورد و یا در موارد استفاده از آینه مقعر عدم دقتی که در بازگشت دادن نور

میتواند داشته باشد نباید از مقدار انحراف نور ناشی از Schlieren جسم مورد آزمایش بیشتر باشد. بعلاوه ابژکتیو نباید دارای حبابهای حتی بسیار ریز باشد زیرا وجود آنها خود خطائی در تصویر پدید میآورد که با انحراف نور در جسم مورد آزمایش مستقیم میشود.

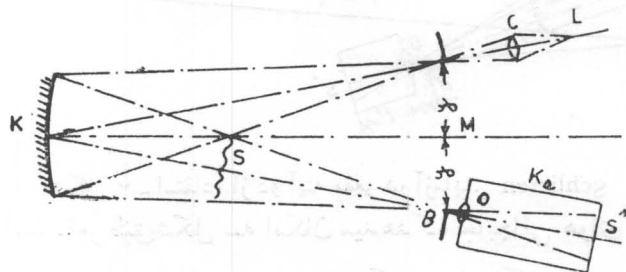
در روش Toepler جسمی که مورد آزمایش قرار میگیرد در بین ابژکتیو K و تیغه محدود کننده سطح نورانی a قرار گرفته است.

نور تابیده شده از مولد ابژکتیو و جسم مورد آزمایش گذشته و در محل نقطای که جسم دارای Schlieren است از مسیر خود به میزان بسیار کوچکی منحرف شده و این انحراف کوچک سایه اندازی کرده و محل Schlieren نمایان میگردد.



شکل ۱: دستگاه Schlieren بکاربرده شده توسط Toepler

اگر خواسته باشیم حساسیت این دستگاه را بالا ببریم واضح است که تعداد دفعات عبور نور از جسم و ابژکتیو را زیاد میکنیم و از این راه دستگاه را حساس تر و دقیق تر میسازیم. بجای ابژکتیو K میتوان از آینه های مقعر استفاده کرد. یکی از طرق استفاده از این آینه ها در شکل ۲ نمایش داده شده است.



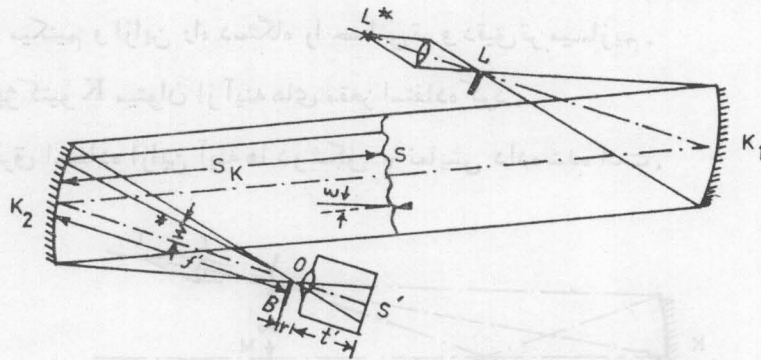
شکل ۲

شکل ۲ - استفاده از آینه مقعر در ساختن دستگاهی برای آزمایش Schlieren

در این دستگاه مولد نور و تصویر آن هر دو در یک سمت مرکز آینه قرار میگیرند. جسم مورد آزمایش در نور بازتاب آینه قرار میگیرد. فاصله جسم تا آینه باید به اندازه کافی انتخاب شود تا جسم در مسیر نور که به آینه تابیده میشود قرار نگیرد. چنانکه از شکل پیداست در اینجا تصویر مولد نور بوسیله دسته انواری مایل ایجاد میشود و بنابراین خطائی آستیگماتیک پدید میآورد اما این خطا تأثیر چندانی در حساسیت دستگاه نخواهد داشت.

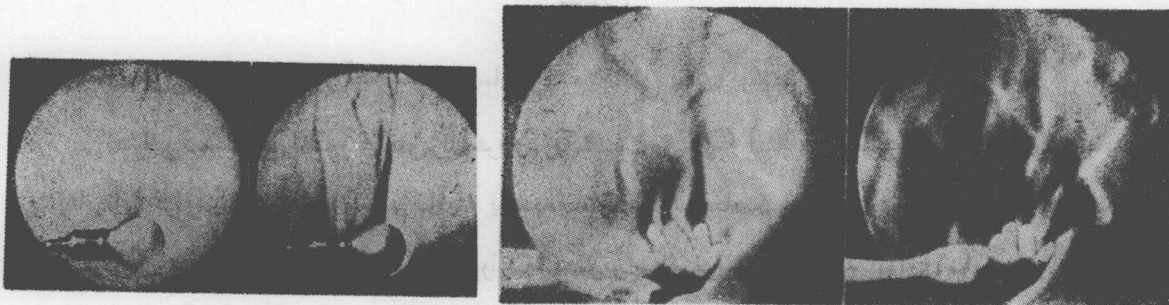
باید دقت شود که مولد نور، مرکز آینه و تصویر مولد نور هر سه در یک سطح واقع گردند. بعلاوه بمنظور بدست آوردن تصویری روشن باید لبه تیغه های محدود کننده نور دقیقاً موازی لبه مولد نور قرار گیرند. لبه های این تیغه ها باید کاملاً صاف و صیقلی بوده و حتی در زیر میکروسکوپ ناهمواری نشان ندهد. در غیر این صورت در متن شکل راه راه های تاریک و روشنی بیچشم میخورند. هرچه قدر فاصله Y (شکل ۲) کمتر باشد بهمان نسبت خطای ناشی از تعقر آینه کمتر خواهد بود مثلاً برای آینه های مقعر با شعاع ۶ متر که قطر آنها ۳ سانتی متر باشد فاصله $Y = 50 \text{ Cm}$ مناسب است. اغلب دقت و حساسیت بیشتری در تصویر بدست میآوریم اگر از دو آینه مقعر استفاده کنیم (شکل ۳) و در بین این دو آینه که نور موازی می تابند جسم مورد آزمایش را قرار دهیم. در نظر اول تصور میشود که فاصله SK جسم مورد آزمایش از آینه K_2 هر چه بیشتر باشد حساسیت دستگاه آزمایش بیشتر است. لیکن محاسبه نشان می دهد که این فاصله بهیچوجه در حساسیت دستگاه مؤثر نیست. بر طبق این محاسبه هر تغییر جا « $\Delta a'$ » که تغییر زاویه ϵ را در مسیر نور به همراه دارد بهیچوجه تابعی از sk نیست بلکه $\Delta a' = \epsilon \cdot f'$ میباشد.

تجربه نشان میدهد که اگر مولد نور در یک سمت آینه ها و دستگاه عکاس در سمت مقابل قرار گیرد خطای ناشی از تعقر آینه کمتر خواهد بود. آزمایشهای اولیه در این زمینه بوسیله Tutner M. Czerny نشان میدهد که در این حالت زاویه تابش نور به آینه اول و بازگشت نور از آینه دوم نیز یکسان میگردد.



شکل ۳ - استفاده از دو آینه مقعر در آزمایش Schlieren

استفاده از دو آینه مقعر طبق شکل سه امکان میدهد که جابجائی هوای گرم و سرد را از یک لامپ ویا از دست طبق اشکال ۳/۱ و ۳/۲ بوضوح مشاهده و عکس برداری کرد.

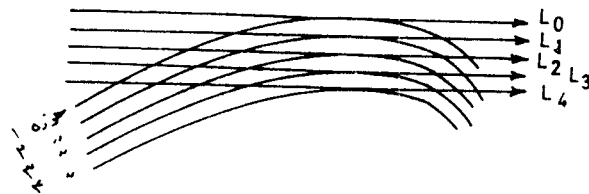


اشکال ۳/۱ و ۳/۲ جابجائی هوای گرم و سرد از دست و لامپ

۲ - اصول نظری برای محاسبه کمیت‌های مختلف از طریق انحراف موضعی نور

۲/۱ - تعیین عدد شکست نور بوسیله انکسار نور در یک Schliere

کلیه روشهای مختلف Schlieren در یک نتیجه مشترکند و آن تعیین شکل و تعیین میزان بزرگ شدن یک Schliere است. لیکن در سالهای اخیر با استفاده از برخی از این روشها توانستند مقدار کمی شکست نور را پس از عبور از یک Schliere تعیین کنند. بدیهی است که این عدد تنها کافی برای شناسائی کامل و خصوصیات داخلی یک Schliere نیست بلکه در کنار آن باید شرایط دیگری را نیز ملحوظ داشت تا بتوان بطور کلی وضعیت Schliere را تعیین کرد. مهمترین شرط قبلی شناسائی کافی نسبت به منحنی نشان داده شده در شکل (ع) است. فرض میکنیم که خطوط مستقیم L_0 تا L_4 نمایش یکدسته نور را میدهند که از محیطی عبور میکنند. شعاع نوری L_0 بدون شکست از کنار یک Schliere عبور میکند و در انتهای مسیر خود صفحه‌ای را روشن میکند در روی این صفحه بعلت اصل سایه اندازی در کنار موضع L_0 سایه‌ای پدید میآید زیرا که L_1 و L_2 و سایر شعاعها بعلت برخورد با Schliere از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند. شعاع نور L_1 از حوزه‌ای میگذرد که در بین دو سطح با Gradn ثابت محدود شده است (سطوحی که در صفحه کاغذ بوسیله منحنی‌ها ساخته میشوند. شکل (ع)). این صفحات باید بعنوان صفحاتی شناخته شده فرض شوند و در این حوزه



شکل ۴ - مسیر اشعه L_0 تا L_4

محدود تمامی Gradn ها را یکسان فرض کرده و محاسبه کنیم با توجه به این شرایط میتوانیم با در دست داشتن شکست نور از شعاع L_1 ، Gradn را در حوزه اول محاسبه کنیم. شعاع نور L_2 از دو حوزه یک و دو عبور می‌کنند و از آنجا که Gradn مربوط به حوزه یک را میشناسیم با در دست داشتن ϵ_2 می‌توانیم Gradn را برای حوزه ۲ حساب کنیم. شعاع L_3 از سه حوزه یک و دو و سه عبور میکنند. Gradn برای حوزه‌های یک و دو را داریم و Gradn برای حوزه سه را میتوانیم از ϵ_3 محاسبه کنیم و به همین طریق عمل محاسبه را برای مناطق دیگر ادامه دهیم. بنابراین مسیر کلیه Gradn ها را خواهیم داشت و بکمک انتگرالی از آنها ضریب شکست را بدست خواهیم آورد. حتی در بسیاری از موارد در صورتیکه فرم و شکل Schliere مشخص نباشد با تابیدن نور از جهات مختلف به جسم شکل و فرم آن را نیز بدست می‌آوریم. رابطه زیر مبدأ محاسبه انحراف نور از مسیر خود میباشد (تئوری عدسیها).

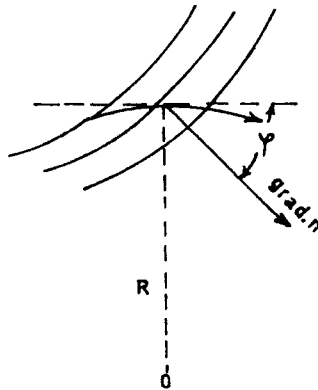
(۱)

$$\frac{1}{R} = - \frac{\text{grad} n}{n} \cdot \sin \varphi$$

که در آن :

R شعاع خمش نور

n ضریب شکست نورو

 φ زاویه بین Gradn و جهت عبور شعاع نور است شکل (۵).

شکل ۵ - زاویه خمش شعاع نور هنگام عبور از محیط غیرهمگن

در شکل ۶ محور z نشان دهنده اشعه نور موازی تاییده شده است مؤلفه های شعاع نوری که به نقطه $X_i ; Y_k$ وارد شده است عبارتند از :

$$(\varepsilon_x)_{x=x_i ; y=y_k} \quad \text{و} \quad (\varepsilon_y)_{x=x_i ; y=y_k}$$

در شکل ۶ برای نقطه P که در میان یک Schliere واقع شده است Gradn را رسم میکنیم Gradn با محور z زاویه φ را تشکیل میدهد. از آنجا که در داخل Schliere با دقت کافی میتوان برای نور جهت مستقیم فرض کرد پس بر روی محور z منطبق می گردد. حالا از Gradn و نقطه $X_i ; Y_k$ که شعاع نور گذشته است یک صفحه عبور میدهم که آن را صفحه η مینامیم. انحراف نور در نقطه P در این سطح انجام میگیرد و از آنجا که مسیر شعاع نور را میتوان تقریباً مستقیم فرض کرد (زاویه شکست بی نهایت کوچک است) پس $\eta' \ll 1$ و اگر رابطه :

$$\frac{1}{R} = \frac{\eta''}{(1 + \eta'^2)^{3/2}} = \eta''$$

را بگذاریم و $\eta' \ll 1$ را در نظر بگیریم خواهیم داشت :

$$\eta'' = \frac{\text{grad} n}{n} \cdot \sin \varphi$$

و اگر این روابط را در رابطه (o) قرار دهیم خواهیم داشت :

$$(v) \quad X'' = \frac{\partial^2 X}{\partial Z^2} = \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial X}$$

$$Y'' = \frac{\partial^2 Y}{\partial Z^2} = \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial Y}$$

در تمامی موارد که n بعنوان ضریبی در رابطه قراردادده میشود میتوان به تقریب قابل قبول بجای n عدد شکست در شروع Schliere یعنی (no) را گذارد.

پس :

$$X'' = \frac{1}{n_o} \frac{\partial n}{\partial X}$$

$$Y'' = \frac{1}{n_o} \frac{\partial n}{\partial Y}$$

و همانطور که گفتیم میتوان مسیر نور در داخل Schliere را خط مستقیمی فرض کرد پس X'' و Y'' تنها از Z تبعیت خواهند کرد.

انحراف ϵ_x در نقطه ای با مشخصات $X_i ; Y_k$ و $x_i ; y_k$ (ϵ_x) عبارت است از :

$$(\epsilon_x)_{x_i ; y_k} = \int_{Z_1}^{Z_2} \frac{1}{n} \left(\frac{\partial n}{\partial X} \right) X_i ; Y_k dZ$$

$$(\epsilon_y)_{x_i ; y_k} = \int_{Z_1}^{Z_2} \frac{1}{n} \left(\frac{\partial n}{\partial Y} \right) X_i ; Y_k dZ$$

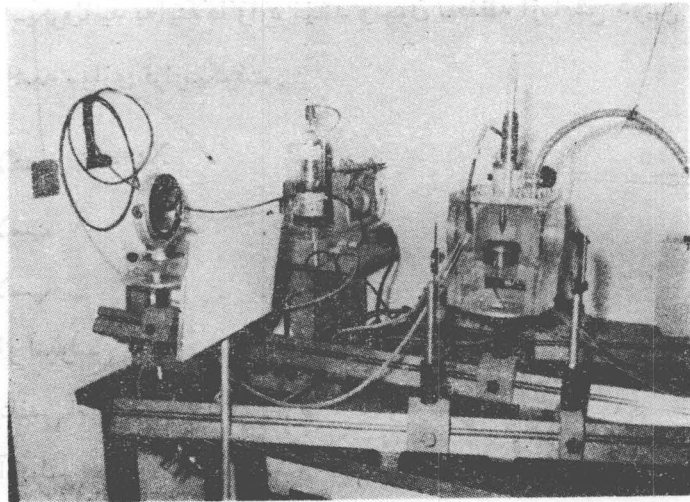
اگر مشخصات موضعی n داده شود به آسانی میتوان ϵ یعنی انحراف نور در Schliere را بوسیله روابط بالا محاسبه کرد.

۳ - بررسی تخلیه الکتریکی جریان ناشی از هدایت الکتریکی در عایق مایع (پارافین مایع) بکمک روش Schlieren .

بیان مکانیزم تخلیه الکتریکی ناقص در عایقهای مایع علیرغم کوششهای . ϵ ساله تا کنون بروشنی انجام نپذیرفته است و در این زمینه تئوری مدونی چون گازها موجود نیست .

اینجانب نیز در مدت اقامت در دانشگاه لندن کوشید که با استفاده از روش Schlieren در زمینه

نحوه گسترش و توسعه جریان ناشی از هدایت الکتریکی در عایق و تخلیه الکتریکی ناقص در آن بررسی کند. برای این منظور در نظر گرفته شد که بر روی قطبهای الکتریکی دستگاه مورد آزمایش که عبارت از محفظه‌ای محتوی پارافین مایع بود (شکل ۷) امپوسی الکتریکی با دامنه‌ای بزرگ گذارده شود (مثلاً در این آزمایش از ۱ تا ۲ کیلوولت بر روی فاصله الکترودها در حدود ۳ تا ۵ میلیمتر) زمان امپولس از ۲ تا ۱۰ میکروثانیه انتخاب شد و هر باره با استفاده از یک منبع نوری و آینه‌های مقعر جریان عبوری از عایق رؤیت گردید تا از بررسی آن نتایجی درباره شکل و نحوه گسترش جریان هدایتی بدست آورده شود.



شکل ۷ - دستگاه آزمایش محتوی پارافین با الکترودهای سوزن - صفحه

۱-۳ - دستگاه محتوی پارافین مایع با قطبهای الکتریکی

برای این منظور طبق نقشه داده شده در شکل (۷) محفظه‌ای از Prospex ساخته شد که در دو طرف آن دو شیشه بدون حباب مجوف قرار گرفت که از یک سمت نور وارد و از سمت مقابل که کاملاً موازی با سمت ورودی بوده خارج می‌شد. این محفظه دارای مشخصات زیر بود:

- ۱ - کاملاً آب بندی بوده و برای نگهداری خلأی در حدود 10^{-2} میلیمتر جیوه آمادگی داشت.
 - ۲ - فاصله قطبهای الکتریکی نصب شده طبق شکل بوسیله میکرومتری تغییر می‌پذیرفت تا بتوان یکمک آن در قبال ولتاژ معینی شدت میدان را تغییر داد.
 - ۳ - در قطب الکتریکی بشکل صفحه محفظه‌ای تعبیه شده بود که در صورت لزوم بتوان با تعبیه مقاومتی الکتریکی آن را گرم کرد.
- انتخاب Prospex اجازه میداد که محفظه در موقع گذاردن ولتاژ الکتریکی بر روی قطب کاملاً بی‌زوله باقی بماند و ضمناً از خارج داخل محفظه قابل رؤیت باشد.

۲ - ۳ وسائل آزمایش برای Schlieren

در این آزمایش از دو آینه مقعر بقطر $2/5$ اینچ استفاده شد که در حقیقت با توجه به بودجه مالی موجود انتخاب شده بود (با بزرگتر انتخاب کردن آینه حساسیت آزمایش را میتوان بالا برد) این آینه ها و دستگاه مورد آزمایش بر روی ۳ پایه فلزی متحرک که در آزمایشگاه کالج در مدت ۳ هفته ساخته شد قرار میگرفت .

از مولد نور که عبارت از یک لامپ (فلاش) Xenon با مشخصات زیر بود ، آمپولس نوری با زمانهایی بین ۲ تا ۱۰ میکروثانیه به آینه ها وارد میشد و چون محفظه آزمایش در بین دو آینه قرار گرفته بود در حقیقت مورد تابش اشعه موازی قرار میگرفت .

مشخصات لامپ Xenon

ولتاژ نامی لامپ	۲۰۰۰ ولت
قدرت نامی لامپ	۲۰۰ ولت
حداکثر ولتاژ آمپولس	۳۰۰۰ ولت
حداکثر فرکانس آمپولس	۵۰۰ کیلوهرتز
زمان ثابت آمپولس	۱ میکروثانیه
قطر لامپ	۲۰ میلیمتر
فاصله قطبها	۳ میلیمتر

۳ - ۳ - مدار الکتریکی برای لامپ Xenon

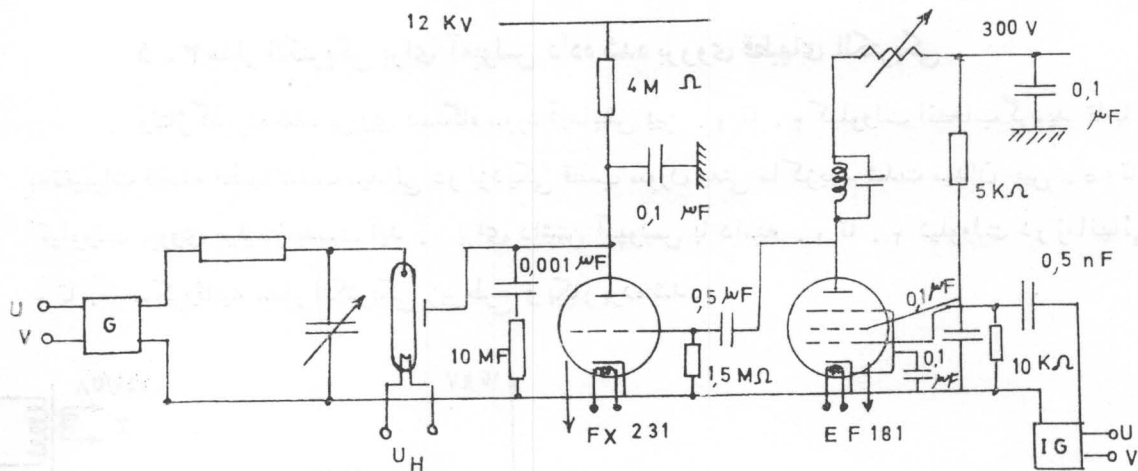
برای عکس برداری از تخلیه الکتریکی در مایع همانطور که قبلاً گفته شد باید از ژنراتور آمپولس با زمانی بین ۲ تا ۱۰ میکروثانیه به مولد نور و در همان زمان به قطبهای الکتریکی محفظه عایق داد و نور تابیده شده که از محفظه میگذرد در برخورد با درات باردار الکتریکی که از قطبی به قطب دیگر میروند تغییر مسیر بسیار کوچک داده و سبب سایه اندازی شده بدین قسم میتوان تخلیه الکتریکی و گسترش آن را در مایع با دادن آمپولس در زمان مثلاً ۲ میکروثانیه دید .

آمپولسهای بعدی با طول زمان بیشتر و مشاهده یا عکسبرداری از آنها طریقه گسترش و مکانیزم تخلیه الکتریکی و مسیر جریان هدایتی را در عایق مایع نشان خواهد داد .

بدیهی است بجای عکسبرداری از هر آمپولس میتوان با داشتن دوربین عکاسی بسیار سریع بیکباره با گذاردن ولتاژی دائم بر روی قطب آند گسترش و وسعت یافتن تخلیه الکتریکی از صفر تا اتصال کوتاه بین دو قطب را از طریق Schlieren عکسبرداری کرد (برنامه ادامه کار در آزمایشگاه دانشکده فنی) درحالتی

که هر بار یک آمپولس با زمانی معین بر روی قطب‌های الکتریکی بگذاریم و در همان زمان قوس در بین قطب‌های لامپ ایجاد کنیم مشاهدات و یا عکسهائی در هر بار از تخلیه الکتریکی در این زمان داریم و اگر عکسهائی مثلاً از آمپولسهای ۲ - ۴ - ۶ - ۸ - ۱۰ میکروثانیه برداریم و در کنار یکدیگر گذاریم توسعه تخلیه ناقص الکتریکی از قطبی به قطب دیگر را از زمان صفر تا ۱ ثانیه خواهیم داشت که میتواند پایه‌ای برای بیان تئوری درباره مکانیزم تخلیه الکتریکی در مایع باشد.

برای مدار الکتریکی لامپ Xenon تقویت کننده‌ای لازم بود که آمپولسهای ژنراتور آمپولس را با دامنه‌ای برابر ۱۳ هزار ولت تقویت کرده بدون آنکه در زمان آن تغییری بدهد. این آمپولس ۱۳ هزار ولتی برای Trigger لامپ Xenon به قطب کمکی آن هدایت میشود (شکل ۸).



IG - ژنراتور آمپولس

G - مرقد جریان یکسو

شکل (۸) طرح اصولی مدار آمپولس برای لامپ

تقویت کننده برای Trigger لامپ بوسیله اینجانب در آزمایشگاه ساخته شد و برای ساختمان آن از دو لامپ EF184 و تیراترون Fx231 استفاده گردید (شکل ۸). محفظه فلزی و الکترودهای لامپ Xenon نیز در آزمایشگاه مکانیک کالج ساخته شد.

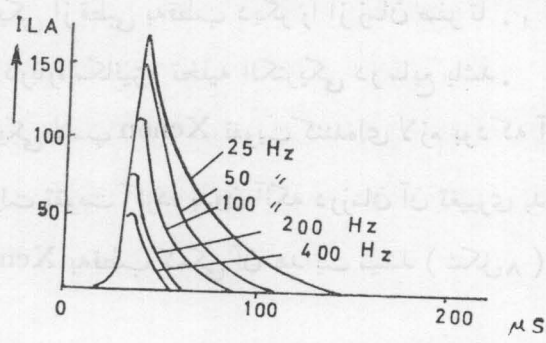
۳ - ۴ - زمان کار لامپ Xenon و توان کاپاسیتو مدار

زمان قوس الکتریکی لامپ چنانکه میدانیم از زمان عبور جریان و همچنین زمان خنک شدن گاز

تبعیت میکند. انرژی الکتریکی که در لامپ به اشعه و حرارت تغییر فرم مییابد از رابطه کلی :

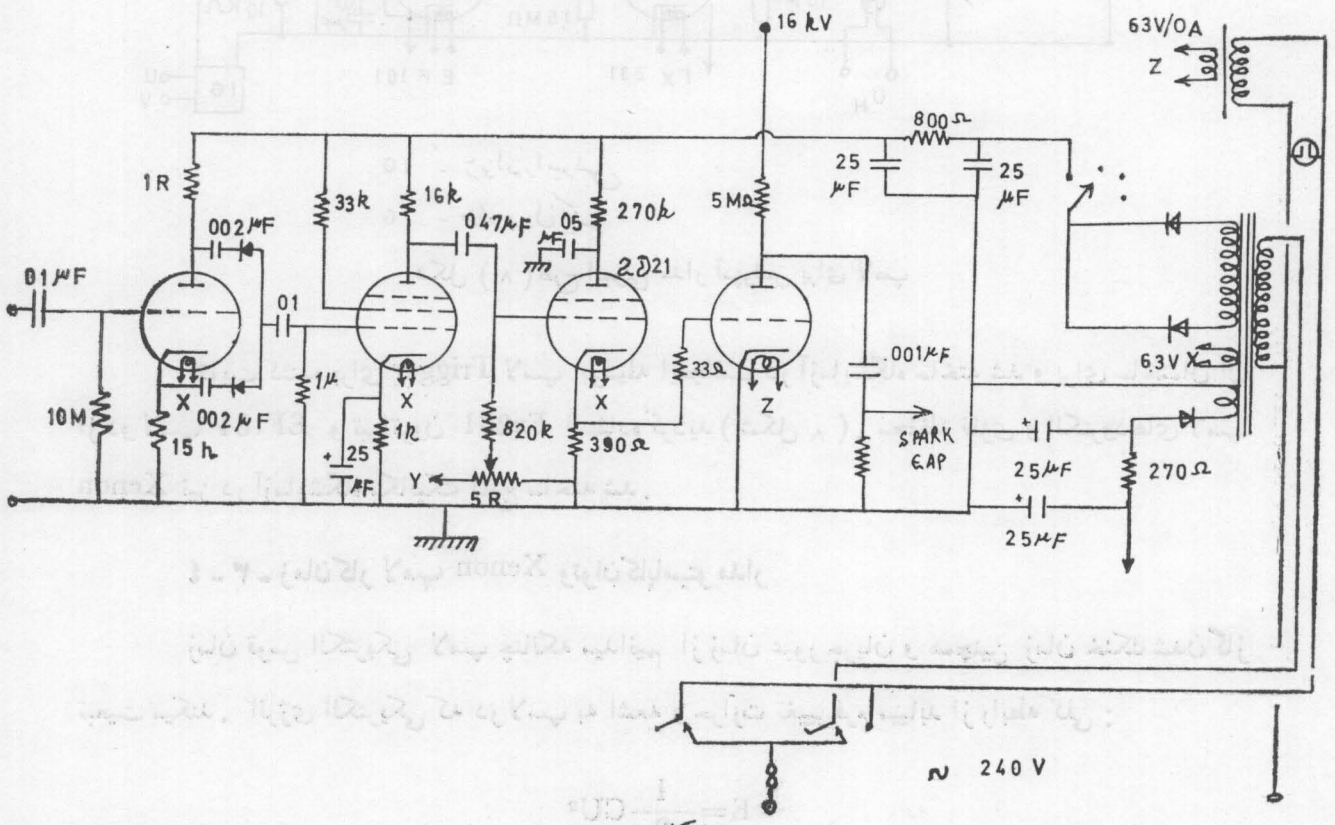
$$E = \frac{1}{2} CU^2$$

بدست میآید هرچه ولتاژ گذارده شده بر دوسر قطب های لامپ بیشتر باشد در مقابل ثابت ماندن انرژی، کاپاسیته لازم کمتر خواهد بود. در اینجا با ثابت بودن ولتاژ لامپ زمان قوس الکتریکی در لامپ را با انتخاب کاپاسیته کوچکتر کوتاه تر میسازیم. منحنی زیر تغییرات زمان قوس و شدت جریان قوس را نشان میدهد.



۳-۵ مدار الکتریکی برای آمپولس داده شده بر روی قطبهای الکتریکی

ولتاژ گذارده شده بر روی دستگاه مورد آزمایش بین ۱ تا ۲ کیلوولت انتخاب گردید تا با توجه به تغییرات فاصله قطبها شدت میدانی در نزدیکی قطب سوزن یعنی ماکزیمم شدت میدان بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوولت بر روی میلیمتر بدست آید. برای داشتن آمپولس با دامنه ۱ تا ۲ کیلوولت در زمانهایی بین ۲ تا ۱ میکروثانیه مدار الکتریکی زیر طرح و بکار برده شد.

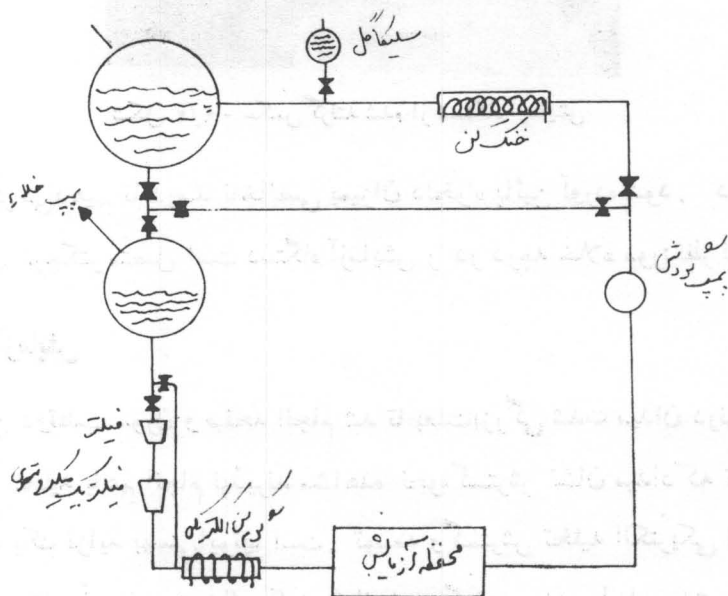


شکل ۹

در این مدار از دولامپ تقویت کننده و یک تیراترون فشار قوی استفاده شد.

۶ - ۳ آماده کردن عایق مایع (در این آزمایش پارافین مایع) برای آزمایش .

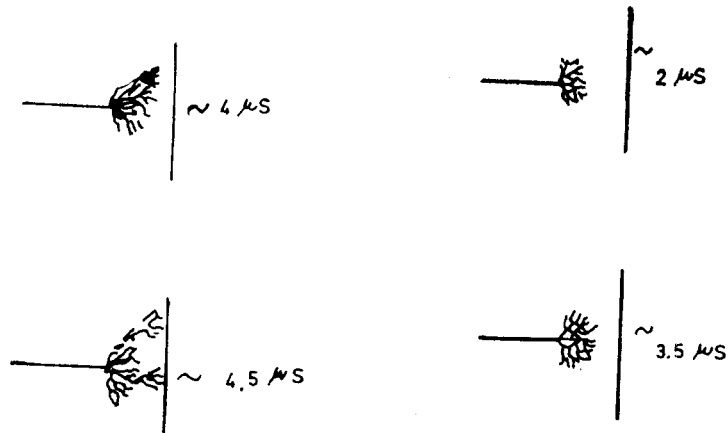
پارافین موجود در بازار معمولاً تصفیه نشده و حاوی ذرات بیگانه بمیزان نسبتاً زیادی است که در موقع آزمایش بین دو قطب الکتریکی پل بسته و مانع از بررسی دقیق تخلیه الکتریکی میشود. بنابراین پارافین باید ابتدا کاملاً تمیز شده و سپس به محفظه آزمایش هدایت شود. برای این منظور دستگاهی که شمای آن در شکل ۹/۱ و ۹/۲ نمایش داده میشود در آزمایشگاه تهیه شد که در آن پارافین ابتدا خلاء و بکمک پمپ سیر کولاسیون تا حد قابل توجهی تمیز گردید. در این دستگاه دو فیلتر ϵ و μ میکرون کار گذارده شده بود و بنابراین پارافین مایع از کلیه ذرات بیگانه که دارای قطری بزرگتر و مساوی ($d \geq 1\mu$) بودند تمیز گردید. بعلاوه دستگاه مزبور صاحب یک گوی شیشه‌ای بود که از سمت فوقانی به پمپ خلائی متصل شده بود و تا حدود 10^{-3} Torr تخلیه میشود و بدین قسم پارافین مایع از حبابهای هوا مبرا شده و استقامت الکتریکی بیشتری را صاحب میشود.



شکل ۹/۱ - شمای دستگاه تصفیه پارافین مایع

چنانکه در شکل دیده میشود دستگاه گردش و تصفیه پارافین مایع صاحب دو مدار است در مدار بزرگتر چندین بار پارافین را از فیلترها گذرانده و مجدداً به محفظه بزرگ وارد میکنیم (گوی بزرگ که در بالا قرار گرفته است - شکل ۹/۱). پس از تصفیه کافی پارافین مقداری از آن را در گوی کوچک که در پائین گوی بزرگ واقع شده است نگه میداریم پارافین از این گوی پس از گذشتن مجدد از فیلتر وارد محفظه مورد آزمایش شده و بوسیله پمپ سیر کولاسیون از مدار کوچکتر به گوی کوچک بازگردانده میشود در صورت وقوع

میداد. نقطه شروع تخلیه الکتریکی بعلت بزرگ بودن کاپاسیته عایق نسبت به هوا همانند هوا کاملاً مشخص نبود. این مسئله از لحاظ فیزیکی نیز کاملاً مورد انتظار بود زیرا کاپاسیته بزرگ مانع از این خواهد



شکل ۱۰ - نحوه گسترش تخلیه الکتریکی در پارافین

بود که منحنی جریان با شروع تخلیه الکتریکی بطور مشخص و بارزی تغییر مسیر دهد. قوسهای الکتریکی فرعی که از هر کدام از دوایر اصلی جدا شده و بطرف قطب اند میروند دارای پایه رقصنده‌ای در روی دایره قبلی بوده و تغییر جا میدهند. خود این قوسها نیز به شاخه‌های دیگر منشعب میگردند لیکن این شاخه‌های فرعی در داخل مایع مرده و ازین میروند. شاخه اصلی اغلب با تغییر مسیری به قطب مخالف رسیده و تخلیه الکتریکی را تبدیل بیک اتصال کوتاه میسازد. زمان **Recombination** نسبت به گاز زیادتر بوده و اکثراً وجود بار الکتریکی که در نزدیکی دو قطب تشکیل میگردد مانع از آن است که در فواصل کوتاه مجدداً آزمایش را تکرار کرد.

علت اینکه اتصال کوتاه از آخرین دایره بوسیله یک قوس تقریباً مستقیم ایجاد میشود و تخلیه الکتریکی در شعاعهای متحدالشکل گسترش نمییابد خود بعلت همین بار الکتریکی فضائی است. بررسی تأثیر این بار الکتریکی که صاحب زمان بقای طولانی‌تر است بر روی مراحل آخری گسترش الکتریکی خود مسئله‌ای جالب است که باید بررسی شود.